

ブルカーのナノ表面計測システム

● AFM(原子間力顕微鏡)

原子像観察が可能な高分解能・高性能AFMや大型試料向けAFM、機械特性・電気特性等の様々な特性をナノスケールで計測可能なAFMなど、ポリマー、材料、半導体、太陽電池、ライフサイエンス等の分野で基礎から応用研究まで必ずお探しのAFMが見つかるラインナップです。

大好評!

SPMモードポスター
無料贈呈中!

・各種測定モードを図解
・装置の側に貼付して手軽に参照

ご希望の方は、裏面下のメールからお申込みか、WEBページからお申込み下さい。www.bruker-nano.jp



キャンペーン中



世界最速
高分解能 AFM
Dimension FastScan
参考価格 (基本システム)
¥46,000,000-(税抜)

- Dimension Iconをベースに新開発したFastScanスキャナを搭載し、高分解能と高速スキャンを両立させたシステム。
- 従来のAFMシステムと比べて20~100倍以上のスピードで表面形状や粗さ測定が可能。
- 自動最適化イメージングモードScanAsyst搭載。



大型ステージ搭載
高性能 AFM
Dimension Icon
参考価格 (基本システム)
¥27,000,000-(税抜)

- 210mmの自動サンプルステージを搭載しながらも、原子像を取得できるレベルまでノイズフロアを低減。
- 非常に高い剛性を有する機構とIconスキャナにより、ドリフトレートの大幅に低減。
- 自動最適化イメージングモードScanAsyst搭載。



高分解能小型試料用 AFM
MultiMode8-HR, E/J
参考価格 (基本システム)
(HR) ¥19,000,000-(税抜)
(E/J) ¥14,800,000-(税抜)

- 非常に高い剛性と低ノイズフロアを実現した、世界で最も多く使われているSPMシステム。
- 形状測定から機械・電気特性、電気化学測定が可能。
- 液中測定、加熱冷却測定などの環境制御測定にも対応。
- 高速スキャン機能も追加可能。(HR)



大型ステージ搭載
汎用型AFM
MDimension Edge
参考価格 (基本システム)
¥19,000,000-(税抜)

- Dimension Iconと同様に剛性の高いステージ設計を採用した自動ステージ型システム。
- Iconスキャナを採用しており、150mm角全面フルアクセス可能な自動ステージを搭載。



ライフサイエンス用AFM
BioScope Resolve
参考価格 (基本システム)
¥31,000,000-(税抜)

- 生きた細胞の機械特性を定量的にマッピングする最も優れたバイオAFM。
- 倒立型顕微鏡との組み合わせにより様々な生体サンプルの光学的観察と高解像度AFM解析をシームレスに実現。
- ニコン・オリンパス・ライカ・カールツァイス製の倒立型顕微鏡と互換性を提供。

● 3次元白色光干渉型顕微鏡

光干渉方式を採用し、非接触、非破壊、高速で広範囲における3次元の形状や粗さを高い性能で測定することができます。30年に渡りWyko (ワイコ) の名で親しまれ、現在ではContour, NPFLXシリーズとなり、拡張性や操作性、機能が各段に向上しています。



汎用型3次元
白色光干渉型顕微鏡
ContourGT-K
参考価格 (基本システム)
マニュアルシステム
¥14,600,000-(税抜)
オートシステム
¥21,500,000-(税抜)

- 内部レンズ交換・対物レンズ交換・試料ステージの手動・電動選択が可能な仕様により、使用目的とご予算にミートした装置構成を実現。
- 0.1nm Ra~10mmの幅広いZ方向測定ダイナミックレンジをクロスドレーブで制御可能。



卓上型全自動3次元
白色光干渉型顕微鏡
ContourGT-I
参考価格 (基本システム)
¥31,400,000-(税抜)

- 電動傾斜調整ヘッド装備により、操作性や試料ステージの耐荷重が向上 (10Kg)。
- 高さが150mmまでの試料に対応し、R&Dから工程管理まで幅広く使用が可能な全自動仕様。
- 防振機能内蔵 (オプション)。



大型ステージ採用全自動 3次元白色光干渉型顕微鏡 ContourGT-X

参考価格 (基本システム)
¥ 39,950,000-(税抜)

- 電動傾斜調整ヘッド・自動ステージを有する光干渉粗さ計。
- フォーカス位置を中心に振り子状に傾斜調整する事で、傾斜調整時の測定中心の位置ズレを回避。
- スループットが格段に向上したシステム。
- 防振台一体型設計。



大型サンプル対応全自動 3次元白色光干渉型顕微鏡 NPFLEX

参考価格 (基本システム)
¥ 31,000,000-(税抜)

- 最大試料サイズ304x304 x249mm最大試料重量50kg対応。
- ±45度まで振れる傾斜調整ヘッドにより、局所的な表面形状測定が可能。
- 長作動距離型対物レンズと90度偏光プリズムの組み合わせにより、エンジンボアシリンダー内側面のクロスハッチ評価等の側壁評価も可能に。

● 触針式プロファイリングシステム

40年以上業界をリードしてきたDektakシリーズの第10世代目。測定パフォーマンス、使い易さにこだわり、マイクロエレクトロニクス、半導体、太陽光パネル、高輝度LED、医療、材料科学分野において重要となるナノメートルレベルの表面測定を可能にします。



触針式プロファイリングシステム Dektak XT

参考価格 (基本システム)

XT-E手動ステージ

¥ 6,500,000-(税抜)

XT-S手動ステージ

¥ 7,400,000-(税抜)

XT-A手動ステージ

¥ 9,350,000-(税抜)

- シングルアーチトップ設計による4 Å以下の優れた測定再現性。
- 測定時間を40%向上した新しいハードウェア構成。
- 直観的な操作を可能にするVision64インターフェース設計。
- 用途に合わせてステージ仕様の異なる3タイプ(S/E/A)を用意。

● 摩擦摩耗試験機

2000年のデビュー以来、ユニークなモジュール方式による設計とコンパクトなプラットフォームの採用により、市場で最も使用されている摩擦摩耗試験です。



摩擦摩耗試験機 UMT TribLab

参考価格 (基本システム)

¥ 14,750,000-(税抜)

- ベースシステムに統合された高性能モーター
- ノイズレベルをフルスケールの0.02%に低減させたゴールドシリーズセンサー
- システムコンポーネントの自動認識が可能なTriboldチップ
- アクションブロックによるスクリプト構築が可能なTriboScriptソフトウェア
- 比類のない測定性能、柔軟性、使い易さを兼ね備えた最新モデル。

● ナノインデントーションシステム

ナノインデントーションは顕微鏡で圧痕観察を行わず、荷重変位曲線から硬さ、弾性率を測定することができる装置です。



ハイジトロン トライボインデント Hysitron TI980

参考価格 (基本システム)

¥ 50,000,000-(税抜)

Hysitron TI Premier

参考価格 (基本システム)

¥ 35,000,000-(税抜)

- 特許技術の静電駆動トランスデューサによる低荷重インデント。
- 押し込み圧子を使った走査プローブ顕微鏡モード。
- 微小領域における正確な測定箇所の決定。
- ナノレベルでの動的粘弾性測定。
- 最先端の有機材料、複合材料、生体材料などの機械的特性評価を実現。



SEM/TEM電子顕微鏡 組み込み型 ピコインデントーションシリーズ PI85L / PI88 / PI95

参考価格 (基本システム)

¥ 29,800,000-(税抜)

- 本装置はSEMやTEMといった電子顕微鏡に組み込むことにより、試料の変形や破壊の挙動がリアルタイムで観察が可能で深さ方向変位の曲線から硬さや弾性率を測定が可能。
- 粒子やピラーの圧壊試験や、マイクロビームの曲げ試験、Push to Pullデバイスによる引っ張り試験など様々な機械強度評価が可能に。